

# 2024年 新春電子顕微鏡解析技術フォーラムのお知らせ

公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会  
責任者 和田 充弘  
実行委員長 石丸 雅大

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な問題点をざっくばらんに話し合う場として《電子顕微鏡解析技術フォーラム》を開催いたします。

今回の新春フォーラムでは、夏のフォーラムテーマ「材料物性の謎を解き明かそう！電子顕微鏡による結晶構造解析」をフォローアップし、チュートリアルでは TEM による CBED を用いた空間群の決定や歪などの評価について基礎から学びます。また、トピックスでは、注目度の高い4D-STEMやパワーデバイス、光誘起による機能特性変化まで、結晶構造解析により物性を解き明かそうとする研究について、各方面でご活躍されている先生方にご講演頂きます。

さらに今回は、名古屋大学超高压電子顕微鏡室の見学ツアーも企画しております。普段なかなか見ることのできない日本が誇る装置を実際に見ることができるチャンスです！電顕に携わる皆様、奮ってご参加ください！

## 記

- 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会
- 日時：2024年1月26日(金)13:00～17:30(予定) (懇親会～20:00 予定)
- 会場：名古屋大学 EI 創発工学館 FUJI ホール (名古屋市千種区不老町)
- 参加費：2,000 円(日本顕微鏡学会個人・法人・学生)、2,200 円(協賛会員)、3,000 円(会員外)  
夏フォーラムにご参加の方(1,000 円(日本顕微鏡学会個人・法人・学生)、  
1,100 円(協賛会員)、2,000 円(会員外))

※日本顕微鏡学会会員の参加費は不課税です。その他の学会員の参加費は課税対象となります。

〈協賛学会員〉 医学生物学電子顕微鏡学会、応用物理学会、軽金属学会、日本バイオイメージング学会、日本化学会、日本解剖学会、日本金属学会、日本結晶学会、日本工学会、日本細胞生物学会、日本材料科学会、日本組織細胞化学会、日本鉄鋼協会、日本表面科学会、日本病理学会、日本物理学会、日本分析化学会、日本臨床分子形態学会

懇親会費：1,000 円

- 定員：100名
- 申し込み期間：2024年12月4日(月)～(定員になり次第締め切ります)
- 申し込み方法：12月4日に電子顕微鏡解析技術フォーラム HP 上にてお申込みフォームの URL を公開いたします。サイトにアクセスして頂き、必要事項をご記入の上、お申込みください。  
HP：[顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会 \(https://j-sm-at.sakura.ne.jp/db/\)](https://j-sm-at.sakura.ne.jp/db/)  
注意事項)なお、1月18日以降のキャンセルについては、お支払い頂いた参加費の返金は致しません。  
代理の方のご参加をご検討ください。



## 8. 主な内容 ※敬称略

### 『チュートリアル』

・収束電子回折(CBED)法を用いた結晶点群・空間群と格子歪みの決定 津田健治(東北大学)

### 『トピックス』

・4D-STEM 法の界面やその場観察への応用 森川大輔(東北大学)

・パワーモジュールの接合部での信頼性設計技術 福本晃久(三菱電機)

・化合物半導体におけるナノスケール転位挙動と室温塑性 中村篤智(大阪大学)

### 『設備見学』

・超高压電子顕微鏡が実材料分析に有用であることを知っていますか？ 武藤俊介(名古屋大学)

・名古屋大学 超高压電顕の見学と特徴・運用事例紹介

〈電子顕微鏡解析技術フォーラム実行委員〉

フォーラム実行委員：石丸 雅大(サーモフィッシャーサイエンティフィック)、乾 光隆(セイコーエフソン)、遠藤 徳明(日本電子)、川元 寛章(日立ハイテック)、木村 耕輔(東レリサーチセンター)、工藤 修一(キオクシア)、志摩 会実佳(東芝ナノアナリティクス)、高橋 知里(産総研)、丸山 秀夫(カネテック)、水尾 有里(日鉄テクノロジー)、宮澤 知孝(東京工業大学)、武藤 俊介(名古屋大学)、村上 和歌子(リコー)、森 貴仁(ローム)、吉田 誠(旭化成)、和田 充弘(三井金属)



2024年 新春電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム  
「結晶解析と物性～材料物性の謎を解き明かそう！電子顕微鏡による結晶構造解析～」

会場：名古屋大学 EI創発工学館FUJIホール

12:30 ~ 13:00	受付開始	名古屋大学 EI創発工学館 FUJIホール
13:00 ~ 13:10	開会挨拶 実行委員長 石丸 雅大(サーモフィッシャーサイエンティフィック)	
[チュートリアル]	座長:木村 耕輔(東レリサーチセンター)	
13:10 ~ 14:20	収束電子回折(CBED)法を用いた結晶点群・空間群と格子歪みの決定 東北大学 多元物質科学研究所 津田 健治 様	
[トピックス]		
14:20 ~ 14:50	4D-STEM法の界面やその場観察への応用 東北大学 多元物質科学研究所 森川 大輔 様	
14:50 ~ 15:00	休憩	
[トピック]	座長:丸山 秀夫(カネカテクノロジー)	
15:00 ~ 15:30	パワーモジュールの接合部での信頼性設計技術 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 福本 晃久 様	
15:30 ~ 16:00	化合物半導体におけるナノスケール転位挙動と室温塑性 大阪大学 大学院基礎工学研究科 中村 篤智 様	
16:00 ~ 16:30	超高压電子顕微鏡が実材料分析に有用であることを知っていますか？ 名古屋大学 未来材料・システム研究所 武藤 俊介 様	
[名古屋大学超高压電子顕微鏡施設の見学ツアー]		
16:30 ~ 18:00	グループで見学を行います。 実行委員から見学の順番についてご連絡致します。 お待ちいただいている方は「ざっくばらん」に日頃の疑問などを討論致します。	
18:00 ~ 18:10	閉会挨拶 電子顕微鏡分析技術分科会 代表 和田 充弘(三井金属鉱業)	